



高解像度面歪パターン測定装置 SurfTRiDY

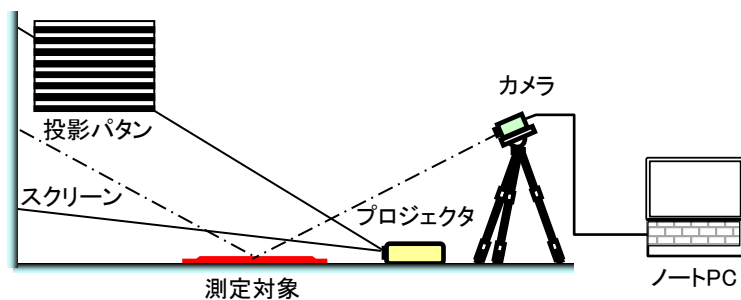
同じ視野サイズで従来のシステムより高解像度で測定できるようになりました。

装置の特長

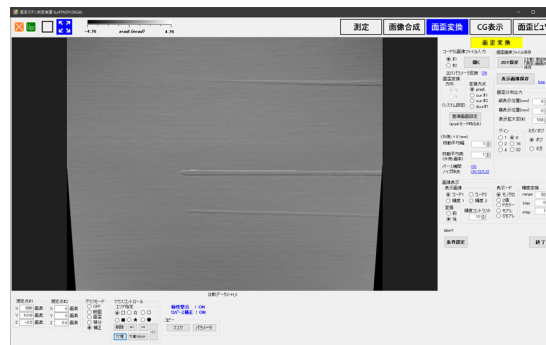
- 鏡面性の高い表面の面ひずみを、傾斜角分布画像、曲率分布画像として表示します。
- 計測用カメラの解像度を1280画素×1024画素に対応することで高解像度化を図りました(従来比:解像度2倍、画素数4倍)。
- より広視野での測定が可能となりました(従来と同等の解像度の場合)。
- 高速測定:撮影時間 約10秒、面歪演算時間 約1秒は従来とほぼ変わりません。
- 豊富な表示・出力:2Dマップ表示・鳥瞰図表示、CSVデータ保存、指定エリア内の最大・最小・標準偏差演算などの機能があります。

装置の構成

装置はカメラ、プロジェクタ、ノートパソコンで構成されており、測定対象に合わせて光学系をセッティングすることで小視野から大視野まで柔軟に測定できます。また、ソフトウェアには測定、画像合成、面歪変換、CG表示、CSV保存の機能があり、各種条件で演算・表示できます。



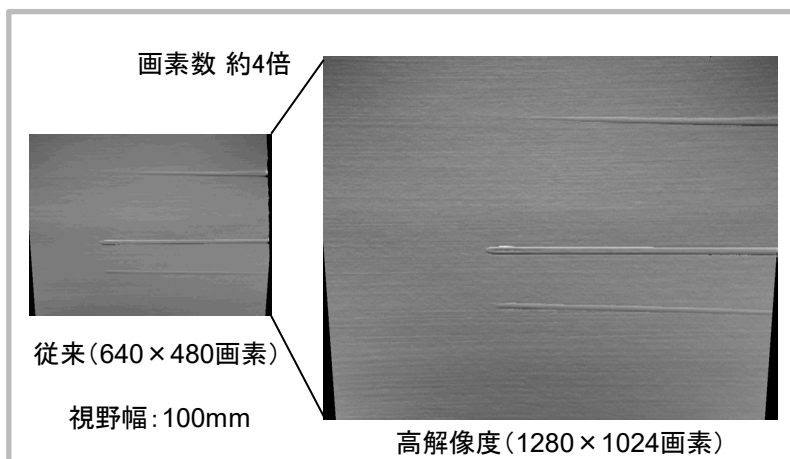
測定光学系



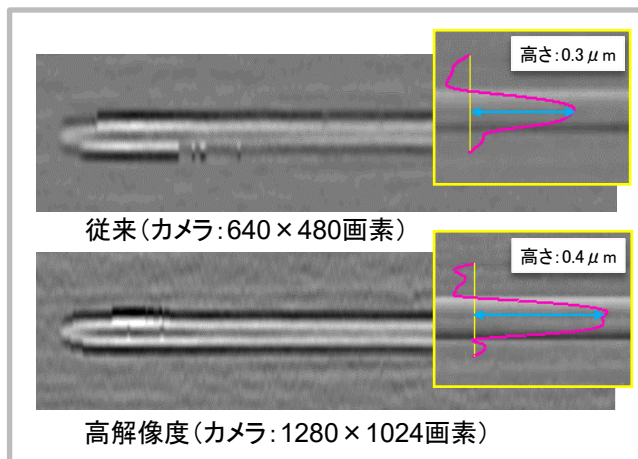
ソフトウェア(演算画面)

測定例

筋状の面歪を持つサンプルを測定した結果を従来のシステムと比較しました。



画像サイズの比較



曲率分布パターン表示の比較と
傾斜角積分断面形状表示(黄色枠内)

※ 受託計測にも対応いたします。